# 光ビームプラットフォーム X線光電子分光ラウンドロビン実験

**AichiSR** 陰地 宏<sup>1,3</sup>, 池野 成裕<sup>1</sup>, 安野 聡<sup>2</sup>, 村井 崇章<sup>1</sup>, 柴田 佳孝<sup>4</sup>, 上原 康<sup>1</sup> <sup>1</sup>科学技術交流財団, <sup>2</sup>高輝度光科学研究センター, <sup>3</sup>名古屋大学, <sup>4</sup>あいち産業科学技術総合センター

## キーワード:光電子分光,相対感度係数,光ビームプラットフォーム

#### 1. 背景と研究目的

3 keV 以上の励起光を用いた放射光光電子分光は、Mg Ka や Al Ka 線を用いる実験室系 XPS に比べて 光電子の脱出深さが大きく、試料のより深部を評価することができる.しかし①分析深さに関する実測 データの不足、②定量評価のための相対感度係数のデータベースが存在しない、といった課題がある。 これらを鑑み光ビームプラットフォーム事業では、SPring-8 の BL46XU 及び AichiSR の BL6N1 におい て、励起エネルギー3 ~ 10 keV の光電子スペクトルの収集を進めている。上記課題②に対しては、酸 素を含む化合物の光電子スペクトルを収集し、O 1s ピークを基準とした相対感度係数を導出することを 目標としている。その一環として本実験では、各種酸化物の光電子スペクトル測定を行った。

### 2。実験内容

今回測定した試料を Table 1 に記す。粉末試料については、熱分析用のアルミニウム製サンプルパン (アルミパン) に粉末試料(導電性の悪い粉末試料については高導電性カーボンブラック粉末(ケッチ エンブラック: KB)を混合)を投入しハンドプレスでプレスしたものを測定に供した。励起光としては、 蓄積リングの常伝導偏極磁石部から放射される白色光を、Ni コート Si ベントシリンドリカルミラーで 集光及び高次光除去後、二結晶分光器で単色化した X 線を用い、励起エネルギーは 3 keV とした。以前 の実験では分光結晶として InSb (111)を用いてきたが<sup>1,2)</sup>, 2018 年度初めに実施した二結晶分光器の更新 により光量が増大し、より狭いバンド幅の励起光が利用できる Si (111)でも実用的な光電子信号強度が 得られるようになったため、今回は Si (111)を採用し、以前に測定した試料についても再測定を行った。 光電子の検出には静電半球型電子分光器(SPECS PHOIBOS 150 CCD)を用いた。測定は室温、入射角 (直入射が 0°) は 55°、光電子の脱出角は 90°(直出射)とし、アナライザーのスリット条件は 7 mm× 25 mm curved とした。測定時の真空度は 10<sup>-7</sup> Pa 台であった。 試料帯電が問題となる試料については、

中和銃(SPECS FG 10/40)による帯電中和を行いながら測定した。

試料名	測定領域(測定順, Ols 領域は2回以上測定)	試料形状, 備考
Au plate	Au 4f	板状 (較正標準)
TiO <sub>2</sub>	wide, O 1s, Ti 2s, Ti 2p, O 1s	粉末, Al pan
TiO <sub>2</sub> _KB*	wide, O 1s, Ti 2s, Ti2 p, O 1s	粉末, Al pan
ZnO	wide, O 1s, Zn 2s, Zn 2p, O 1s	粉末, Al pan
SiO <sub>2</sub> (300 nm) / Si-sub.	wide, O 1s, Si 1s, Si 2s, Si 2p, O 1s	基板上薄膜
NiO	wide, O 1s, Ni 2s, Ni 2p, O 1s	粉末, Al pan
In <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	wide, O 1s, In 3d, O 1s	粉末, Al pan
$Al_2O_3$ -sub.	wide, O 1s, Al 1s, Al 2s, Al 2p, O 1s	板状,中和銃使用
${ m SnO}_2$	wide, O 1s, Sn3d, O1s	粉末, Al pan
Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> _KB*	wide, O 1s, Ta 2s, Ta 2p, O 1s, Ta 3d, Ta 4d, Ta 4f, O 1s	粉末, Al pan
$MnO_2_KB^*$	wide, O 1s, Mn 2s, Mn 2p, O 1s	粉末, Al pan
CoO	wide, O 1s, Co 2s, Co 2p, O 1s	粉末, Al pan
CuO_KB*	wide, O 1s, Cu 2s, Cu 2p, O 1s	粉末, Al pan

Table 1 測定試料リスト (KB\*: 試料帯電対策としてケッチェンブラックを混合)

## 3. 結果および考察

Fig.1に粉末試料調整例を示す。上がTiO2粉末をそのまま、下がTiO2粉末にKBを混合し、それぞれ をアルミパンに入れてプレスしたものである。アルミパンを使った試料調整法は、粉末が密に詰まった 比較的平坦な試料を容易に作製でき、錠剤成型機でペレットを作成するより手間がかからないが、試料 によってはアルミパンにうまくなじまず、試料がアルミパンから容易にはがれてしまう場合があった。 放射光 XPS の場合, 励起光の向きは多くの場合水平方向で, 測定時に試料を垂直にする場合が多いため, 試料が容易に剥がれないような試料調製法は今後の課題である。

Fig. 2 にこれらの試料の XPS スペクトルを示す。前回の報告と同様, KB を混合した試料では試料帯 電が緩和され,約1.4 eV だけ低束縛エネルギー側にピークがある。ピークの半値幅は KB 混合の有無で さほど変わらない。一方で、KBを混合した分、光電子強度が約1/3になりS/Nが悪化しており、さら に Ols ピークに注目すると, 主ピークの高 BE 側の裾が大きくなっており KB に含まれる不純物の影響 が疑われ、どちらの要素も定量性に悪影響を与える可能性がある。そのため試料帯電の影響が大きくな い場合は KB を混合しない試料を測定した方がよいと思われる。スペクトル形状に影響を与えるほど試 料帯電が大きい場合は KB を混合するなどの措置が必要となるが、それに伴う統計精度の悪化や不純物 の影響に十分留意する必要がある。

感度係数データベースのための酸化物の測定において,酸化物は絶縁性が高い試料が少なくない。一 方で放射光 XPS,特に SPring-8 のような高輝度放射光を用いる場合は,著しい試料帯電が発生すること がしばしばある。これらを克服しながら、酸化物試料のデータ蓄積および感度係数導出のための解析を 今後も進めていく。



Fig. 2. TiO<sub>2</sub>の XPS (左: Ti2p, 右: O1s, 上: KB なし, 下: KB あり)

## 4. 参考文献

1. 池野成裕, 安野聡, 渡辺剛, 陰地宏, 村井崇章, AichiSR 2016 年度公共等利用成果報告書(実験番 号:201606007)

2. 池野成裕,安野聡,陰地宏,村井崇章, AichiSR 2017 年度公共等利用成果報告書(実験番号:201703013, 201706108)